

US-01-9



KIM & CHANG
企・張特許法律事務所

HSB/2005-4-28193-D/YKH/CANEKO

BEST AVAILABLE COPY

コメント

担当審査官は、本拒絶理由で、本願の特許請求の範囲第1項～第3項に記載された発明は引用発明1(韓国登録特許第236687号、公告日付2000.1.15)及び引用発明2(韓国公開特許第2002-94636号、公開日付2002.12.18)から容易に発明することができると指摘しています。以下では弊所の意見を申し上げます。

本願発明は画像表示パネル(1)、画像表示パネルの奇数番及び偶数番の画素それぞれに第1電極が連結されたトランジスタ(26及び27)、上記奇数番のトランジスタ(26)の第2電極に接続された第1検査端子(D0;36)及び偶数番のトランジスタ(27)の第2電極に接続された第2検査端子(DE;35)、トランジスタ(26及び27)のゲートに共通に連結されている第1制御端子(34)を含む画像表示装置に関するものです。第1制御端子は画像表示パネルが検査時には第1検査端子及び第2検査端子の信号がデータ線に入力されるようにトランジスタ(26及び27)をイネーブルされるように動作します。このような本願発明の構成によれば、画像表示パネルの検査時に少ない数の端子のみを用いるので検査費用を節減することができます。また、図7のように複数のパネルを検査時にも各パネルの全ての第1の検査端子(36)を相互接続して一つの検査端子(58)に連結して全ての第2の検査端子(35)を相互接続して他の一つの検査端子(57)に連結することによって、検査設備に連結される最終の検査端子の数は2つだけであり、単に各パネルを制御するためにパネル数だけの制御端子(54～56)のみを設けることによって、検査端子の数を増やすずに各パネルを独立的に検査することができるようになります。

KIM & CHANG
金・張 特許法律事務所

引用発明1はシフトレジスタを用いて各ピクセルに複数のパルスを同時に発生するようにし、データ線を高速に駆動することができる特徴とします。特に、引用発明1の実施例5(図15)ではテストイネーブル信号(TG)を通じて検査用信号入力回路(2000)のトランジスタ(M1, M2等)をイネーブルさせ、電源電圧(TC)を各データ線に入力をした後、シフトレジスタ(220)により駆動されるアナログスイッチ(261)を通過して受信される電気的信号を映像信号端子で検出してパネル内の配線状態を検査するようにしています。

引用発明2は図1に示されているように各データ線末端に連結されているデータ駆動集積回路用アウトリードパッド(D01及びD02)を2グループに分類して各グループ内のアウトリードパッドをショッティングバー(52及び53)に相互接続してそれぞれデータテスト用パッド(D1及びFD2)に接続されるようにし、データテスト用パッド(D1及びFD2)とゲート線が接続されたゲートテスト用パッド(G1)を制御して各グループのデータ線及びゲート線を検査することができるようになります。

引用発明1は本願発明の第1及び第2検査端子で入力される信号に該当する電源電圧(TC)、本願発明の第1制御端子に該当するテストイネーブル信号端子(TG)、本願発明の複数のトランジスタ(26及び27)に該当する検査用信号の入力回路内のトランジスタ(M1, M2等)をそれぞれ備えており、本願発明と類似する部分があると判断されます。しかし、引用発明1の検査方法は検査時にパネル内の横方向のピクセル数に比例する全ての映像信号端子(V1, V2, V3, V4等)を通じて電気信号を受信するので、全体パネルを検査するためには全てのピクセルに該当する映像信号端子が検査設備に連結されなければならないという点で、2つの検査端子と1つの制御端子のみを必要とする本願発明と差異があると判断されます。また、複数のパネルを検査するために各パネルに該当する複数の制御端子と2つの検査端子のみを必要とする本願発明と異なり、引用発明1では複数のパネルを検査

BEST AVAILABLE COPY

KIM & CHANG
金・昌 律師事務所

するための方法が開示されておらず、仮に複数のパネルに適用されるとしても各パネルの全ての映像信号端子をグループ別に相互接続しなければならないという問題点があると考えられます。

引用発明2は本願発明のように検査する時にのみテスト用パッドからパネルに電気信号を入力することができるよう制御されるトランジスタを備えられず、複数のパネルをそれぞれ検査することができる制御信号を入力することができず、検査完了後に通常のパネル動作のためにはアウトリードパッド(D01及びD02)を連結するショッティングバーをレーザで分離しなければならないという点で本願発明と差があると考えられます。

以上を審査官に説明しますが、引用発明1及び2との差をさらに明確にできる貴所のご高見乃至補正案があればお知らせ下さるようお願い致します。

以上

BEST AVAILABLE COPY

KIM & CHANG
企・報 特許法律事務所

MSB188/448

メモランダム

本件は、2001年7月1日から施行されている改正特許法の第47条(日本特許法の第17条の2に対応)によって補正の範囲が制限されます。即ち、最初の拒絶理由通知に対する補正時には新規事項の追加が禁止され、最後の拒絶理由通知及び拒絶決定に対する補正時には、補正の範囲が厳格に制限され、特許請求の範囲の減縮、該記の訂正、不明瞭な記載の説明に限って補正が認められます。特に、最後の拒絶理由通知及び拒絶決定に対して特許請求の範囲を補正する場合には、発明の構成要素を変更若しくは削除する補正又は請求項を新設する補正などが一般に認められません。従って、今回の最初の拒絶理由通知への対応時に、現行の特許請求の範囲の記載が適切かどうかを綿密にご検討の上、明細書に記載された内容のうち、保護を受けようとする部分が全て特許請求の範囲の記載に含まれ得るよう、必要な全ての補正を行なうことが望ましいと思料されます。

以上の通り、本拒絶理由への対応時に与えられる補正の機会が、最初の明細書に記載された技術的事項の範囲内において特許請求の範囲を拡張又は変更することができる最後の機会であるという点をご考慮の上、本拒絶理由に対する貴側の対応方案及び/又は特許請求の範囲の補正案をお知らせ下さるようお願い致します。

以上

FIRST AVAILABLE COPY